DVD-R for Dual Layer 物理フォーマットの概要

Outline of Physical Format of DVD-R for Dual Layer

鐘江徹,川野英作,三浦雅浩,大森久聖,加藤正浩 Tohru Kanegae, Eisaku Kawano, Masahiro Miura Kyusho Omori, Masahiro Kato

要 旨 2層DVD-RのLayer 1は、Layer 0を透過したレーザ光で記録されるため、Layer 0上の記録/未記録による透過率変化に起因する記録パワーの変動がLayer 1の記録特性に大きな影響を与える。この課題を解決するため、2層DVD-Rの物理フォーマット策定時においては、Recording Order と呼ぶ記録順序を規定し、ディスク全面でそのRecording Order を満足できる Relative deviation の技術規定の開発を行った。Relative deviation によって、ディスク上でのアドレスの物理配置が規定され、記録機ではLayer 0上の記録状態を監視することなくLayer 1への最適記録を行うことが可能となった。また、関連して評価技術の開発も行い、DVD-R for Dual Layer book version 3.0 part1(physical specification) 規格書へ採用された。

Summary When the second layer (Layer 1) of a DVD-R for Dual Layer disc is recorded, the LASER beam passes through the first layer (Layer 0). In this case, the transparency difference of Layer 0 which comes from its recording status (recorded or unrecorded) considerably affects to the signal reliability of the recorded signal on Layer 1. To avoid this, we have developed and introduced the new technical regulation that is called "Relative deviation" to the specification. The Relative deviation specifies the possible allocation range of the corresponding physical address on each layer.

The Relative deviation is applied to design a disc so that the recorder can record data easily without complicated operation. We have also developed the verification method of the Relative deviation with simple measurement. It has been also adopted in the "DVD-R for Dual Layer book version 3.0 part 1 (physical specification)" book.

キーワード : 2層 DVD-R,物理フォーマット,透過率変化,記録特性,記録パワー変動

<u>1. まえがき</u>

DVD レコーダーは、初めて市場に投入されて以来, VTR に代わる映像機器の中核商品として大きな成長を 遂げた。メディアにおいてもユーザーの利便性を向上 させるべく,DVD-R/RW の高倍速対応メディアが開 発されてきた。また、ハードディスクと記録型 DVD のハイブリッドレコーダーの登場により、録り貯めた 映像の保存用として記録ディスク市場も大きく成長し た。近年、より高画質で、あるいは、より長時間、ディ スクに残したいというニーズより、更なる記録容量の 増加が待たれていた。このような背景の中で、ディス クの片面に 2 層の記録層を持ち、容量を拡大した 2 層 DVD-Rが提案され,筆者らは物理フォーマット開発お よび物理規格策定活動を行った。その結果,2005年 2月にDVDフォーラムからDVD-R for Dual Layer(以 下,DVD-R for DL) book version 3.0 part1(physical specification)が発行され,各社よりDVD-R for DL対 応のライター,レコーダーが商品化されている。本稿 では,その特徴となる技術項目について報告する。

2. DVD-R for DL の概要

2.1 DVD-R for DL の特徴

DVD-R for DL の特徴は, 2 層 DVD-ROM と同じデー タ容量を持つ点である。12 [cm] ディスクおよび8 [cm] ディスクについて,記録容量,標準映像記録時間の比 較を**表1**に示す。

直径 12 [cm] ディスクの場合では,容量が 8.54 [Gbytes] となり,これは,1層 DVD-R の約 1.8 倍の容 量である。その結果,従来以上の高画質あるいは長時 間の記録保存が可能となる。

また,2層 DVD-ROM との互換性を有することも大 きな特徴である。

記録後の DVD-R for DL の物理特性は,表2に示す 通り、2層 DVD-ROM とほぼ同等であるため、DVD 再生機での再生互換性がきわめて高い。DVD-R for DL の現行規格では、実際の使用形態等を考慮し、 Opposite トラックパスのみが規定されている。再生 に関わる点では唯一、反射率の値が若干異なるが、再 生機において、DVD-R for DL を再生するためのハー ドウェアの変更はほとんど必要としない。

表1 DVD ディスクの記録容量と録画時間

		2層	1層				
容量 [Gbytes]	12cm	8.54	4.7				
	8cm	2.66	1.46				
時間 [min]	12cm	218	120				
	8cm	68	37				
(独市工 い、挿進)							

(録画モード: 標準)

表 2	DVD	-R for DL	ディ	スクの	つ物理ス	ペ	יש	ク
-----	-----	-----------	----	-----	------	---	----	---

	1層		2層		
	DVD-ROM	DVD-R	DVD-ROM	DVD-R	
トラックピッチ[μm]	0.74				
最短ピット長 [µm]	0.	4	0.44		
反射率 [%]	45 to 85		18 to 30	16 to 27	
変調度					
ジッター [%]					
トラックパス	_		Parallel / Opposite	Opposite	
記録倍速	-	1x to 16x	-	2x to 8x	

2.2 物理構造

図1に DVD-R for DL ディスクの層構造の一例を示す。 DVD-R for DL ディスクは、2 層の名の通り二つの記録 層を持ち、記録 / 再生レーザ光の入射側より、それぞ れ Layer 0 (以下 L0)、Layer 1(以下 L1) と呼ばれる。

各々の記録層は, 色素層と反射層からなる。色素 層は, 基板上へアゾ系やシアニン系等の有機色素をス ピンコートにより塗布する。そのため, 記録溝 (グルー ブ)部の色素は厚く,溝間(ランド)は薄く形成される。

反射層はスパッタにより金属系材料が成膜される。 L0 側の反射層は,L1 層ヘレーザ光を透過させる必要が あるため,半透過となるような薄めの反射層が成膜され る。L1 側の反射層は,レーザ光を透過する必要が無い ため,1 層 DVD-R と同等の厚さの反射膜が成膜される。

L0とL1の間は,透明樹脂材料の中間層により一定 の間隔が保持される。DVD-R for DLでは,記録再生時 にピックアップがL0,L1いずれかの層へフォーカスを選 択的に切り替えるため,この間隔は,記録再生信号に層 間クロストークが生じない値となっている。

図2は,あるディスクのL0層およびL1層記録時 における,ピックアップからのレーザ出射パワーと, それによって記録された信号品質(ジッター値)の例 を示している。

DL ディスクでは前述のように,層構造の違いから, L0,L1 各々でのレーザパワーや記録ストラテジなどの 最適記録条件が異なることが許されている。このディス クの例では,グラフから分かるように,ジッター値が最 良となる記録パワーも記録層により異なっている。

すなわち,それぞれの層において良好な再生信号 品質を得るためには,ディスクの層構造に適合した, 各層の最適化が必要であり,さらにそれぞれ最適な記 録条件によって書き込みを行うことが必須となる。



図 1 DVD-R for DL ディスクの層構造



2.3 ディスクレイアウトおよび記録方式

DVD-R for DL は、前述したように、これまでの1 層 DVD-R/RW と異なり、層状に2つの記録層を持つ 構造となっている。

ディスク上,各層でのエリア配置を,図3に示 す。Information area にはユーザデータが記録される データエリア (Data area) と,Lead-in area / Lead-out area, Middle area が存在する。これらの構成および 配置は、2層 DVD-ROM に準じている。Information area より内周部には、レーザパワー校正に使用され る Inner Disc Testing Area (IDTA) と、記録情報が格納 される Recording Management Area (RMA) が配置さ れる。これらの構成は1層 DVD-R に準じている。ま た、Information area より外周部には、外周部でのレー ザパワー校正に使用される Outer Disc Testing Area (ODTA) が配置される。

また、データエリアへの記録方式としては、1 層 DVD-Rと同様の Incremental recording 方式が採用 されているが、新たな記録方式として、Layer Jump recording 方式が追加されている。これは、L0 層とL1 層へ交互にデータを記録していく方法である(図4)。



図 3 DVD-R for DL エリアアサイン



図 4 Recording mode

2.4 DVD-R for DL 開発の技術的課題

DVD-R for DL では,L1 層の記録 / 再生がL0 層を 透して行われる。L0 層へ入射したレーザ光は,色素 からなる記録層を透過するが,この際,ある割合の 光量が吸収される。L0 記録層を透過したレーザ光は, 半透過である L0 反射層において一部が反射され,残 りの部分が透過,中間層を透ってL1 記録層へと到達 する。つまり,L0 記録層へは,ピックアップから出 射された光量のほぼ全てが到達するのに対して,L1 記録層への到達光量は,L0 層における吸収および反 射を除いた部分となる (図5)。

ここで、色素記録膜はその原理上、未記録と記録 後の状態で光学特性が変化するため、前述した透過光 量も変化する。これにより、L1 層への記録を行う場 合、L0 層が未記録か記録済みであるかによって、ディ スクへの入射光量に対するL1 層への透過光量の効率 が変化することとなる。

L0 層が未記録あるいは記録済みにおける L1 層の 記録パワー対ジッター値およびアシンメトリ値の実験 結果を図6に示す。このグラフより、L0 層が未記録 である場合に比べ、記録済みである方が低パワー側に



図 5 L1 層への到達光量模式図



図6 L0 層状態の違いによる L1 層記録特性

特性グラフがシフトしている,つまりL0層の透過率 が上がることによりL1層への透過光量の割合が上昇 していることがわかる。このため,ジッター値の結果 に見られるように,L1層への記録時,L0層が未記録 か記録済みであるかによってピックアップからの最適 出射パワーが異なることになる。

つまり,L1への記録を行う際に,L0の記録/未記 録状態が定められていないと,L1に良好な記録を行 うためには,記録時にL0層上の記録状態を検出して パワーを切り替えるというような複雑な制御が必要と なる。これを回避するためDVD-R for DL においては, 記録済みのL0層を透して,L1層の記録を行うことが 規格で定められた。この記録順序の規定を Recording Order と呼んでいる。

さらに,L1 層記録時のL0 層記録状態を考える際 には,L0 層上における記録部 / 未記録部の境界につ いても考慮が必要となる。

例えば L0 層から L1 層への切替アドレス付近では, L1 層記録時に,L0 層が記録済みと未記録の領域境界 での記録となる。つまり,記録レーザ光の一部分が, L0 層を透過する際,一部分が未記録であり,他の部 分が記録済みであるということが生じうる。

さらに、ディスクの物理的な誤差を考慮すると、 記録トラックの周内でも、L0層透過部分の記録/未 記録の状態が変化することが考えられる(図7)。

この状態で通常の記録を行った場合,切替アドレス 付近ではL1層に記録された信号の品質が低下し,読み 込みに不具合を生じる可能性が高くなる。または,記録 時に,L0層の記録状態を常に監視して記録レーザ出力 を制御するなど,非常に煩雑な動作を必要とする。

DVD-R for DLの規格中では Recording Order に対

応し,ディスク上において,アドレスの物理的な位置 をあらかじめ設定することで,煩雑な制御を必要とす ることなく,記録品質の低下を避ける規定を行った。 この技術について,次章において詳細に述べる。

3. Relative deviation 技術開発

Incremental recording mode と Layer jump recording mode い ず れ の 記 録 方 式 に お い て も Recording Order が満足されるような LO/L1 両層の トラック間の物理的間隔に関し技術的検討を行った。 Relative deviation と呼ぶそのトラック間の物理的間隔 について順に述べる。

Relative deviation におけるディスク物理要素 クリアランス

L0 層とL1 層各々の記録層の間には、中間層と呼 ばれる透過層が存在する。この厚みは、DVD-R for DL の場合,約 55 [μm](規格中心値)である。

記録層に対してレーザ光が焦点を結ぶ場合,レー ザ光はピックアップ上の対物レンズにより円錐状に 集光される。このため,L1層に対する記録の際には, L0層上において,ある半径を持った円形の領域を通 過することとなる。この半径は,中間層の厚みと屈折 率,対物レンズのNAに依存する(図8)。

前述の Recording Order を守るには、レーザ光の L0 層透過領域内が記録済みでなければならず、この ため L0 層上の記録済領域外周から透過領域の半径分 領域の内側方向までの L1 層が記録可能となる。この 値を、クリアランスと呼んでいる。

DVD-R for DL 規格上で許容される公差を含んだ, 中間層厚,中間層屈折率および対物レンズの NA をパ ラメータとする,LO 層上の透過光領域の最大半径は



図7 偏芯による透過領域の状態変化



図8 L0 層上でのレーザスポット径

約34 [µm]となる。

したがって,所要のクリアランスは 34 [μ m] が 与えられる。しかしここで,レーザ光のビームプロファ イル形状から,外周部のオーバーラップは影響が少な い。これを考慮し,書き込み容量の減少を避けるため, 規格上では,実際の記録実験結果からデータエリアで は 19 [μ m] のオーバーラップを許し,15 [μ m] を クリアランスの値として採用している (図9)。ただし, 実際の記録機上でディスクの最適パワーを決定するた めに設けられた DTA(Disc Testing Area) では,正確な 値を得るため,領域内でオーバーラップが含まれない ようなアドレス規定がなされている。

3.1.2 ディスク公差

Recording Order を考える上では、さらに各々の記録層トラック間の相対的な偏芯を考慮する必要がある。これは、L1層の記録を行う際、相対偏芯によりL0層上のトラックとの間隔が、ディスクの回転に伴って変化するためである(図10)。

さらに,ディスクはポリカーボネイト樹脂の成形 によって製造されるため,成型時の収縮や,スタンパ



作成時の誤差等によりアドレスの物理半径位置には誤 差が生じる。この誤差をトレランスと呼んでいる。2 層ディスクにおいて層間の関係を考える際は,各々の 層での誤差を加算する(図11)。相対偏芯およびトレ ランスにより,L0層上のアドレスとL1層上のトラッ クの物理位置は,回転の周内で変化する。実際には, ディスクの回転中心との関係により位置関係の推移は 正弦波とは若干異なるが,模式的には図12に示すよ うな波形となる。







相対トレランス = tx + \overline{tx}

図 11 相対トレランス



図 12 Relative deviation のトラック内変動

3.2 Relative deviation

Recording Order を守るために,クリアランス,ト レランスおよび相対偏芯を考慮すると,それらを加算 した値が Relative deviation となる。

L0 層上でのアドレス x における Relative deviation の最大値および最小値は, (1) 式で表される。

$$Dev_{upper}(x) = (rx - \overline{rx}) + (|tolerance|_{max} + |run_out|_{max})$$

$$Dev_{lower}(x) = (rx - \overline{rx}) - (|tolerance|_{max} + |run_out|_{max})$$
(1)

12cm ディスク上でデータエリア最外周での Relative deviation 中心値として 105[μ m] が規定さ れる。これは,最外周半径位置において 23Eh (574)ECC ブロックに相当する。

DVD-R for DL ディスクは CLV 記録を採用している ため、半径位置によって1トラックあたりのデータ長 が異なり、内周へ向かうに従って、1トラックに記録 されるデータ量は減少する。LO 層と L1 層での線密度 が同じであることから、Relative deviation によりオフ セットするデータ量は一定 (23Eh ECC ブロック) であ るため、Relative deviation の値は内周側で増加する ことになり、データエリア最内周部分では 258[µ m] となる。

これらを基に,L0層,L1層各々でのアドレスに対 する半径位置は,(2)式で与えられる。

これと、前述した Relative deviation の式により、 図 13 に示すようなエンベロープが定義される。 すなわち, L0 層とL1 層のアドレス関係が, この エンベロープ内に存在していれば, ディスク全面に対 して Recording Order が守られる。つまり, 記録機は, L0 層の未記録 / 記録を監視するなどの方法を採るこ となく, 記録が可能となる。

$$\begin{aligned} r_{x} &= \sqrt{\left\{ \left(\frac{D_{0}}{2}\right)^{2} \times \pi - (x - X_{0}) \times C \right\}} \div \pi \\ \overline{r_{x}} &= \sqrt{\left\{ \left(\frac{D_{0}}{2} - a\right)^{2} \times \pi - (\overline{X}_{0} - \overline{x}) \times C \right\}} \div \pi \end{aligned} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} X_{0} &: \text{FF CFFFh (L0層内周基準アドレス)} \\ D_{0} &: \phi 48 \text{ mm (L0層内周基準直径)} \\ a &: 2.58 \text{ mm (L0層内周基準Relative deviation)} \\ C &: \overline{\tau} - \varphi \, \overline{\otimes} \, \overline{\operatorname{gc}} \, \overline{\operatorname{cs}} \, \frac{32 \times 1024 \times 8 \times 3.84 \times 0.74}{2418} \\ C &= \frac{32 \times 1024 \times 8 \times 3.84 \times 0.74}{2418} \times \frac{8}{16} \times 26.16 \times 10^{6} \\ (\text{mm}^{2}/\text{ECC block}) \end{aligned}$$

4. Relative deviation 評価方法開発

4.1 評価方法

今回, Relative deviation の規格化において, トレ ランスや相対偏芯等の物理誤差を含め, 総合的に評価 を行う方法を開発した。

この方法は,実際のディスク上へ所定の記録を行い,記録後の信号再生特性を測定することによる。

- 評価方法を以下に示す。
- 1) まず L0 層で一定長の記録を行い,次にこの領域 を含む長さで,L1 上へ記録を行う。この際,L1



図 13 Relative deviation

層への記録は一定の出射パワーを維持して行う。 この結果,L1層上での記録は,L0層が未記録, 境界部および記録状態を順次透過して行われる ことになる。つまり,前述の通りL0層の記録状 態による透過率変化により,L1層では信号品質 が変化していると考えられる。

2) L1 層の信号品質評価においては、アシンメトリ
 特性を観察する。アシンメトリ測定の手順は、(3)
 式および図 14 による。



図 14 HF Signal

L1 層への記録時, アシンメトリ値は, 記録出射 パワーに対して図7に見られるように, 依存性 を持っている。従って, 透過領域のL0層が未記 録であるか記録済みであるかによってもアシンメ トリ値が変化する。



図 15 アシンメトリの遷移

 記録した L1 層上の領域においてアシンメトリ値の 測定を行い,読み出しを行ったアドレスに対してグ ラフ化する。

この手順により測定された結果は、図 15, 16 のように、記録済み部を透過して記録した部分のアシンメトリ値は高く、未記録部を透過して記録した 部分の値は低くなる。したがって、アシンメトリ値の遷移を利用した評価が可能となる。

実際のディスクでは、このアシンメトリ値の遷移 はトレランスおよび相対偏芯の影響を受ける。

これらは, 偏芯およびアシンメトリを全くもたな い理想ディスクにおいて現れるはずの理論値と, 実 際のディスクを用いた場合の測定値の差となり, 図 17~19で示すような現象として現れる。

まず,トレランスは,遷移図における理想的なア ドレスと,測定値のズレとして現れる。これは,ト レランスがL0層とL1層のアドレス位置のズレを意 味するためである。

次に,ディスク上で相対偏芯がある場合,L0層の 未記録/記録境界にかかる部分で,HF波形にディス ク回転に同期した周期的な変動が見られる。この時 に,変動の最大値(top)と最小値(bottom)によりアシ ンメトリ値をプロットしていくと,それぞれの遷移 波形に位相のズレが生じる。このズレ量が相対偏芯 の値を意味している(図18/19)。





図 16 L0 層未記録部 /L1 層記録済部を透過して記録した L1 上での HF Signal



図 18 L0 層記録 / 未記録境界部 HF Signal



この波形上で,遷移部分のアドレス長は記録レー ザの概略直径を意味する。つまり,この測定により ディスク上での理論値と実際の差,すなわち Relative deviation の値を知ることができる。

具体的には、相対偏芯量を考慮するために、HF 波 形上から bottom 値によってアシンメトリ値を測定 し、図 20 および (4), (5) 式に示すように、Relative deviation のエンベロープ上で各々上限側と下限側の 理論値アドレスを求め、比較を行うことにより、対象 となったディスクが規格値を満足するかを判定するこ とができる。



$$M_{Y} = y - \frac{b \times (2 \times R_{Y} - b) \times \pi}{C}$$

$$M_{Z} = z + \frac{b \times (2 \times R_{Z} + b) \times \pi}{C}$$

$$y = \overline{Y} + Ax$$

$$z = \overline{Z} + Ax$$

$$Ax = 23Eh(574) ECC blocks$$

$$(4)$$

$$R_{Y} = \sqrt{\left\{ \left(\frac{D_{0}}{2}\right)^{2} \times \pi - (Y - X_{0}) \times C \right\}} \div \pi$$
$$R_{Z} = \sqrt{\left\{ \left(\frac{D_{0}}{2}\right)^{2} \times \pi - (Z - X_{0}) \times C \right\}} \div \pi \quad (5)$$

$$X_0$$
 := FF CFFFh.
The start address of the Data area.

- D_0 : = $\phi 48.0$ mm. The reference diameter of the start address of the Data area
- *b*: $b = |tolerance|_{max} + |run-out|_{max} + Rb$

$$|tolerance|_{max}$$
 : = 40 μ m
 $|run-out|_{max}$: = 50 μ m
 Rb : = radius of the Laser beam

$$C = \frac{32 \times 1024 \times 8 \times 3.84 \times 0.74}{\frac{2048}{2418} \times \frac{8}{16} \times 26.16 \times 10^6}$$

4.2 評価方法実証実験

前述の方法に基づいて,テストディスクを用いた 実際の測定結果を図 21 に示す。

測定結果より,アシンメトリ値を算出してグラフ 化し,その上へ前述のMy,Mzをプロットすると, 両点ともが記録領域に含まれている。これにより,ディ スク自体はトレランスおよび相対偏芯を持っている が,Relative deviation の規定に適合していることが確 認できる。

これにより, Relative deviation の規定および測定 方法が,実際のディスクにおいても有効に適用可能で あることが確認できたと言える。

この評価方法により,容易に Relative deviation の 測定が行えるため,ディスクメーカーによる検査や, ベリフィケーションラボラトリにおけるロゴ検証等の 効率化が可能となった。





図 21 アシンメトリ実測結果

<u>5. まとめ</u>

以上に述べたように, Relative deviation について の技術開発を行い, DVD-R for DL 上で安定した記録 を行うための必須規定として, DVD-R for Dual Layer Ver.3.0 において採用された。また,この検証方法には, ディスクベリフィケーションの一方法として採用され ている。

現在, DVD フォーラムでは, DVD-R for DL の 8 倍 速を超える規格化が進められている。それによって, 大容量の記録を短時間で行うことが実現される。

また,DVD-R for DLの技術内容を踏襲した2層 DVD-RWの規格化も進行中で,近日中にその規格が策 定される予定である。

2層 DVD-R/RW により,従来の1層と比較して高 画質な,もしくはより長時間の映像が保存可能となる。 またさらに,近年のデジタル放送によって,ハイビジョ ンの普及が進行しつつあり,青色レーザを使用した次 世代 DVD がコンシューマー用途として提案されてい る。しかし,これらが安価に購入が可能となるまでの 間,最新の映像圧縮技術との併用で,2層 DVD-R/RW をハイビジョン映像の保存用とするなどの応用も大い に期待される。

6. 謝辞

本開発を進めるにあたり,ご協力頂いたメディア メーカー各社の関係各位に深く感謝致します。またコ ンポーネンツ技術部の関係各位に感謝します。

参考文献

1)DVD Specifications for Recordable Disc for Dual Layer Part 1 Version 3.0

筆者紹介

鐘江 徹 (かねがえ とおる)

光ディスクシステム開発センター 光ディスクシス テム開発部。DVD-R/RW 関連メカ開発,BD アプリケー ション開発を経て,現在 DVD-R/RW の物理フォーマッ ト開発に従事。

川野英作(かわのえいさく)

光ディスクシステム開発センター 光ディスクシ ステム開発部。LD プレーヤー設計,LD-R システム開 発,レコーダー / ライターシステム開発を経て,現在 DVD-R/RW の物理フォーマット開発に従事。

三浦雅浩(みうらまさひろ)

光ディスクシステム開発センター 光ディスクシス テム開発部。光ディスクピックアップの要素技術開発を 経て,現在 DVD-R/RW の物理規格開発に従事。

大森久聖(おおもり きゅうしょう) 光ディスクシステム開発センター 光ディスクシス テム開発部。光ディスク技術開発, DVD-R/RW 関連ピッ クアップ開発を経て, 現在 DVD-R/RW の物理フォーマッ ト開発に従事。

加藤正浩(かとうまさひろ)

光ディスクシステム開発センター 光ディスクシス テム開発部。光ディスクや光磁気テープの要素技術およ びシステム開発, DVD-R/RWの記録技術開発を経て,現 在 DVD-R/RWの規格策定業務に従事。